

# E DIN EN ISO 17294-1:2022-07 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2022-06-17

**Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 1: Allgemeine Anleitung (ISO/DIS 17294-1:2022); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 17294-1:2022**

**Water quality - Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) - Part 1: General guidelines (ISO/DIS 17294-1:2022); German and English version prEN ISO 17294-1:2022**

---

## Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort.....	9
Vorwort .....	10
Einleitung .....	11
1 Anwendungsbereich.....	12
2 Normative Verweisungen .....	12
3 Begriffe .....	12
4 Grundlage des Verfahrens .....	16
5 Instrumentelle Ausstattung .....	17
5.1 Allgemeines.....	17
5.2 Probenzuführungssystem .....	17
5.2.1 Allgemeines.....	17
5.2.2 Pumpe .....	18
5.2.3 Zerstäubersystem .....	18
5.2.4 Sprühkammer.....	19
5.2.5 Andere Systeme .....	20
5.3 Fackel und Plasma .....	20
5.4 Gaszuführung und Gassteuerung .....	21
5.5 Hochfrequenzgenerator .....	21
5.6 Überführung der Ionen in das Massenspektrometer .....	21
5.7 Beschreibung des Massenspektrometers.....	22
5.7.1 Allgemeines.....	22
5.7.2 Linsensystem .....	22
5.7.3 Kollisions-/Reaktions-Zelle .....	22
5.7.4 Spektrometer.....	23
5.7.5 Detektor .....	23
5.7.6 Alternative Massenspektrometer bzw. Instrumenttypen.....	24
5.8 Signalverarbeitung und Gerätesteuerung.....	25
6 Interferenzen durch begleitende Elemente.....	26
6.1 Allgemeines.....	26
6.2 Spektrale Interferenzen .....	26
6.2.1 Allgemeines .....	26
6.2.2 Mögliche Strategien für die Elimination von Interferenzen durch polyatomare Ionen .....	27
6.3 Nicht-spektrale Interferenzen .....	28
6.3.1 Allgemeines .....	28
6.3.2 Zerstäubungsbedingte Interferenzen.....	28
6.3.3 Interferenzen im Plasma.....	29
6.3.4 Interferenzen in Interface und Linsensystem.....	30
6.3.5 Mögliche Strategien für die Elimination nicht-spektraler Interferenzen (Matrixeffekte).....	30

<b>7</b>	<b>Geräteeinstellungen .....</b>	<b>33</b>
7.1	Allgemeines.....	33
7.2	Optimierung des Geräts .....	34
7.2.1	Allgemeines.....	34
7.2.2	Positionierung des Plasmas.....	34
7.2.3	Massenkalibrierung .....	34
7.2.4	Auflösung.....	34
7.2.5	Detektor .....	35
7.3	Prüfung der Leistungskriterien des Gerätes .....	36
<b>8</b>	<b>Verfahrensentwicklung.....</b>	<b>36</b>
8.1	Allgemeines.....	36
8.2	Wahl der geeigneten Isotope.....	37
8.3	Wahl der Geräteeinstellungen .....	37
8.4	Wahl der Integrationszeit.....	39
8.5	Wahl der Referenzelemente (interne Standards) .....	39
8.6	Linearität und Arbeitsbereich .....	40
8.7	Zusammensetzung der Kalibrierlösungen.....	40
8.8	Verfahrensentwicklung für Kaltplasma-Bedingungen .....	41
8.9	Bestimmung der Leistungsfähigkeit des Verfahrens.....	41
8.9.1	Allgemeines.....	41
8.9.2	Instrumentelle Nachweisgrenze .....	41
8.9.3	Nachweisgrenze des Verfahrens .....	42
8.9.4	Präzision des Verfahrens.....	42
<b>9</b>	<b>Durchführung .....</b>	<b>42</b>
9.1	Allgemeines.....	42
9.2	Kalibrierung.....	42
9.3	Anzusetzende Lösungen.....	43
9.4	Messung.....	43
<b>Anhang A (informativ) Spektrale Interferenzen, Wahl der Isotope und Nachweisgrenzen für Quadrupol-ICP-MS-Geräte .....</b>		<b>45</b>
A.1	Formeln für die Elemente .....	52
<b>Literaturhinweise .....</b>		<b>54</b>

## Bilder

<b>Bild 1 — Schematische Blockzeichnung eines ICP-Massenspektrometers .....</b>	<b>17</b>
---	-----------

## Tabellen

<b>Tabelle 1 — Beispiel für die Zusammensetzung von Interferenz-Kontrolllösungen, um einige häufige Interferenzen zu testen .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabelle A.1 — Spektrale Interferenzen, Wahl der Isotope und Nachweisgrenzen für Quadrupol-ICP-MS-Geräte .....</b>	<b>39</b>